## 02 Дифракционная ловушка для нейтронов ангстремного диапазона

## © Т. Чен

Московская государственная академия тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова E-mail: docent65@mtu-net.ru

## Поступило в Редакцию 16 июля 2001 г.

Получена оценка глубины проникновения тепловых нейтронов ( $\lambda \sim 1$  Å) в изогнутый кристалл при их обратном брэгтовском отражении. Показано, что при падении нейтронов на кристалл под углом, близким к краю кривой брэгтовского отражения, возможны накопление нейтронов внутри кристалла и последующий (через  $\sim 1 \div 100\,\mu s$ ) их выброс из кристалла.

Тепловые нейтроны с длиной волны  $\lambda \sim 0.1 \div 1$  Å ведут себя подобно жесткому рентгеновскому излучению при динамической дифракции на кристаллах. Все параметры динамической дифракции для нейтронов качественно не меняются, но поглощение падает по сравнению с рентгеновским случаем более чем на три порядка. Это дает возможность использовать для нейтронов толстые кристаллы толщиной в несколько сантиметров.

Рассмотрим дифракционное рассеяние пучка нейтронов на изогнутом кристалле с радиусом изгиба *R* в плоскости рассеяния (см. рисунок). Из геометрических соображений имеем:

$$t^{2}/\sin^{2}\theta = R^{2} + (R+t)^{2} - 2R(R+t)\cos\psi,$$
(1)

где t — толщина кристалла,  $\theta$  — брэгговский угол.

Положим угол  $\psi$  равным полуширине кривой брэгговского отражения  $\Delta \theta = |\chi_{hr}| / \sin 2\theta$ . Здесь  $\chi_{hr}$  — вещественная часть фурьекомпоненты поляризуемости кристалла для нейтронного излучения.

Решая квадратное относительно *t* уравнение, получим для толщины кристалла, участвующей в дифракционном брэгговском отражении нейтронов:

$$t = \left[ R(\Delta\theta)^2 + \left\{ R^2(\Delta\theta)^4 + 4R^2 \operatorname{ctg}^2 \theta(\Delta\theta)^2 \right\}^{1/2} \right] / 2 \operatorname{ctg}^2 \theta.$$
(2)

38



Проникновение нейтронного излучения ангстремного диапазона в глубь изогнутого кристалла при брэгговской динамической дифракции.

Для углов дифракции  $\theta \neq \pi/2$  из (2) следует:

$$t \approx R(\Delta \theta) \operatorname{tg} \theta. \tag{3}$$

Видно, что при  $R\sim 1\,{
m m},\,\Delta\theta\sim 10^{-6},\,{
m tg}\,\theta\sim 2$ толщина  $t\sim 2\,\mu{
m m}.$ 

При обратном брэгговском рассеянии ( $\theta \approx \pi/2$ , ctg  $\theta \approx \cos \theta \leq \theta$ ) глубина проникновения нейтронов резко возрастает:

$$t \approx \{(5)^{1/2} + 1\} R/2,\tag{4}$$

что составляет при  $R \sim 1 \,\mathrm{m}$  величину  $t \sim 1.6 \,\mathrm{m}$ .

Формула (2), а следовательно, и оценки (3), (4) не учитывают влияния поглощения. Понятно, что при обратном отражении оптимальную толщину кристалла необходимо выбирать, учитывая наряду с обычным поглощением и экстинкционное поглощение.

Письма в ЖТФ, 2002, том 28, вып. 8

Известно [1], что амплитуда дифрагированного идеальным плоским кристаллом излучения ангстремного диапазона на глубине *z* равна:

$$E_h(z) = E_h(0)(-1)^m (1-\xi)^{z/d} \approx E_h(0)(-1)^m \exp(-k_{ext}z), \qquad (5)$$

где m — целое число,  $k_{ext} = \xi/d = q(1 - y^2)/d$  — коэффициент экстинкционного поглощения, q — коэффициент отражения одной плоскостью, d — межплоскостное растояние, y — нормированная угловая переменная.

Выражение (5) может быть обобщено и на случай упругоизогнутого кристалла. Из выражения (5) следует, что длина экстинкции равна

$$\Lambda \cong d/q(1-y^2)^{1/2}.$$
 (6)

Коэффициент экстинкции  $k_{ext}$  для упругоизогнутого кристалла зависит от координаты z, так как межплоскостное расстояние d линейно изменяется с глубиной.

Для нейтронов, падающих на кристалл под углом, близким к краю кривой отражения ( $|y| \approx 1$ ), экстинкционная длина  $\Lambda$  сильно увеличивается. Выбирая толщину кристалла  $t \ge 1 \text{ cm} \sim \Lambda$  ( $|y| \approx 1$ ), можно осуществить "ловушку" для нейтронов с временем T их накопления в кристалле:

$$T \approx t/v, \tag{7}$$

где v — скорость нейтронов. Численная оценка при  $\lambda \approx 1.5$  Å,  $t \approx 1$  cm дает  $T \approx 4 \mu$ s.

Покачивая кристалл в пределах ширины кривой отражения, через время T можно "выпустить" нейтроны из кристалла. Очевидно, что в этом случае кристалл является своеобразным "затвором" для нейтронов с характерным временем "запирания"  $T \sim 1 \div 10 \, \mu s$ . Полученная оценка времени T может быть теоретически улучшена еще на 1–2 порядка, если взять  $\lambda \leq 10$  Å и  $t \sim 10$  сm.

Используя соотношение неопределенностей  $\Delta E \Delta \tau \sim h$ , оценим влияние немоноэнергетичности (немонохроматичности) нейтронного пучка на полученные выше оценки времени накопления *T*.

Здесь E = hv — энергия нейтрона, v — частота, h — постоянная Планка,  $\Delta \tau$  — время жизни нейтрона в кристалле,  $\Delta v/v = 2\Delta v/v$ , v — скорость нейтрона.

Будем считать размеры кристалла такими, что потерями нейтронов через боковые поверхности кристалла за счет многократного отражения

Письма в ЖТФ, 2002, том 28, вып. 8

Покажем теперь, что, фокусируя выходящие из кристалла нейтроны, можно существенно увеличить плотность потока нейтронов. Пусть поток тепловых нейтронов с плотностью  $\Phi \sim 10^7$  neutron/cm<sup>2</sup> s падает на кристалл с размерами  $\sim 1 \times 1 \times 1$  сm. Причем в этом потоке могут находиться нейтроны различных энергий (немонохроматичный поток). Тогда за время  $T \sim 100 \, \mu$ s в кристалле накопится  $\sim 10^3$  нейтронов.

Предположим, что при покачивании кристалла вблизи брэгговского угла происходит "выход" нейтронов из кристалла с потерей 99% указанного числа накопленных нейтронов. Тогда при фокусировке вышедших из кристалла нейтронов в дифракционное пятно размерами  $\sim 10 \times 10 \,\mu m$  плотность нейтронов составит величину порядка  $10^7$  neutron/cm<sup>2</sup>, что на четыре порядка лучше плотности падающих на кристалл нейтронов.

## Список литературы

- [1] Пинскер З.Г. Рентгеновская кристаллооптика. М.: Наука, 1982. 392 с.
- [2] Чен Т., Кузьмин Р.Н. // Письма в ЖТФ. 1991. Т. 17. В. 10. С. 51–54.

Письма в ЖТФ, 2002, том 28, вып. 8